

# マイクロビームアナリシス研究会

5月21日（火）

テーマ：「放射光による物質の原子レベルイメージング」

- 13:00～13:40 招待講演  
○解良 聡（分子科学研究所）  
「有機半導体分子の電子状態の特徴とその局在性の変遷」
- 13:40～14:15 招待講演  
○大東 琢治（分子科学研究所）  
「UVSORにおける走査型透過X線顕微鏡の応用研究」
- 14:15～14:50 ○小川 貴志（韓国標準科学研究院）、高井義造（大阪大学）  
「シリンドリカルレンズを使用した電子顕微鏡用モノクロメータの開発」
- 14:50～15:20 休憩・ポスターセッション
- 15:20～15:55 招待講演  
○佐々木 裕次（東京大学）  
「X線1分子追跡法とその汎用化から生まれた新計測法」
- 15:55～16:30 招待講演  
○松井 公佑、唯 美津木（名古屋大学）  
「オペランドCT-XAFS法による固体高分子形燃料電池の3次元イメージング」
- 16:40～17:50 分子研施設見学  
18:00～20:00 意見交換会

5月22日（水）

- 9:30～10:05 ○松井 文彦（分子科学研究所）  
「共鳴光電子回折と極端紫外光電子分光ビームライン刷新整備計画」
- 10:05～10:40 GRMN 構築分科会活動報告  
○角森 史昭（東京大学）ほか  
「八代海の海底土壌のラドンとラジウム濃度分布の特徴」
- 10:40～11:05 休憩
- 11:20～11:30 研修セミナー開催報告  
○北村 壽朗（島津製作所）
- 11:30～12:00 ○後藤 敬典（名古屋工業大学、物質材料研究機構）  
「AES・SEのDBと仕事関数の実験的考察その2」

## ポスター発表

○小川 貴志（韓国標準科学研究院）、高井義造（大阪大学）、山澤雄、川井聡、毛利淳、荒井紀明、片根純一、揚村寿英（日立ハイテクノロジーズ）

「シリンドリカルレンズ型モノクロメータの走査型電子顕微鏡への応用」

○野島 雅（東京理科大学）

「回転電場を用いた水クラスティオンの連続質量分離」

○田口 達也（浜松ホトニクス）

「マイクロフォーカス X 線源を用いた X 線非破壊検査の撮影事例と最新 動向」

○白木 将（日本工業大学）

「表面界面制御・分析技術を活用した全固体電池研究」

○松井 文彦（分子科学研究所）「UVSOR-III 施設紹介」